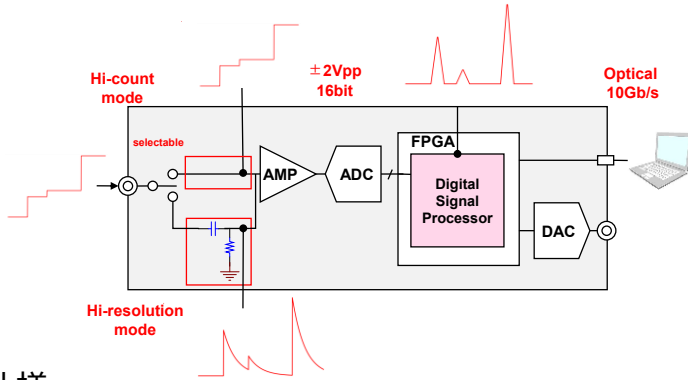


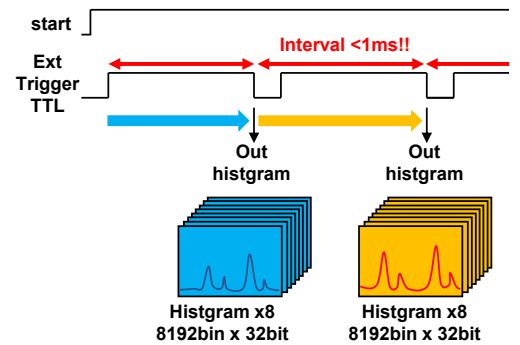
Hi-ResolutionとHi-Count の選択可能な2つの入力モードを備えた高分解・高計数を実現した計測装置です。  
 Hi Resolutionモードは従来通りでAC接続によって任意に入力ゲインを変更できます。高分解能が必要とされる多元素をSDD/HPGeによる測定、低ノイズ特性が必要な軟X線領域をSDDによる計測、広いダイナミックレンジが必要とされる多元素HPGeによる計測などに使用できます。  
 Hi-countはDC接続で増幅機能を失う代わりに、プリアンプのリセット時間を最小にしてデットタイムを「限界まで」削減し分解能を少々犠牲としますが、SDDにおける限界の超高計数を引き出すことが可能としました。  
 さらに10Gbpsのイーサネットを搭載。データ転送レートの高さを生かして、ヒストグラムを外部トリガーで転送できるHigh speed Quick Scan計測を1ms以下の超高速で計測することができます。従来のQuick Scanに比べ10msから1ms間隔に短くでき、8kチャンネル化、データ深さ16bit-32bit選択、インプットカウントデータ付加、チェックサムデータ付加をしており、より高度な解析が可能です。



### 高分解・高計数 ブロック図



### High speed Quick Scan計測



### 仕様

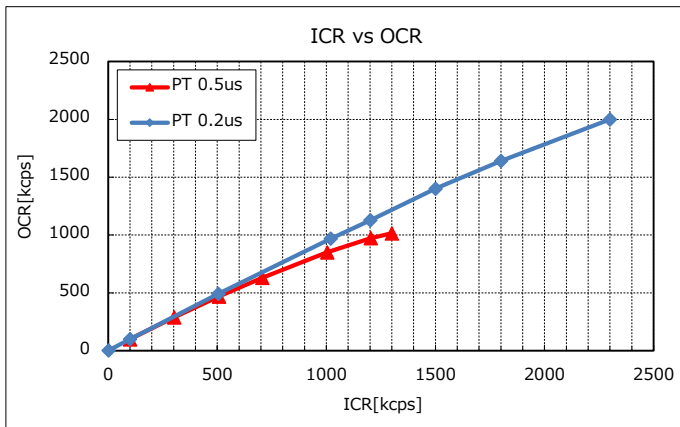
アナログ入力	8チャンネル、LEMOコネクタ、入力レンジ±2V、入力インピーダンス1kΩ
アナログゲイン	Hi-resolution Coarse : x1, x2, x5, x10 Fine : 0.5、0.75、x1、x1.25 Hi-count Coarse : x1 オフセット調整可
ADC	100Mps, 16bit
ADCゲイン	8k, 4k, 2k, 1k, 512, 256 ch.
デジタル信号処理	台形フィルタ 0.05~12μs、ベースラインレストアラ、パイルアップリジェクタ 等
信号処理モード	Hi-resolutionモード、Hi-countモード
計測モード	ヒストグラム、 High speed Quick Scan (高速ヒストグラム転送、最小周期1ms、8192ch、16bit-32bitカウント選択、インプットカウント、チェックサム)
機能	ROI-SCA (LVTTTLロジック出力)
外部制御	クロック入出力、クリア入力、ゲート及びHigh speed Quick Scanゲート入力 等、LVTTTLまたはTTLロジック信号、LEMOコネクタ
オプション	FAST-SCA (ROI-SCAとInputタイミングでLVTTTLロジック出力)
通信	TCP/IP, 10GBASE-SR (データ転送用)、UDP (コマンド送受信)
電源	AC100V, 50/60Hz
寸法・重量	210(W) x 52(H) x 250(D) mm、約1700g

※写真はイメージです。※記載内容は予告なく変更することがあります。

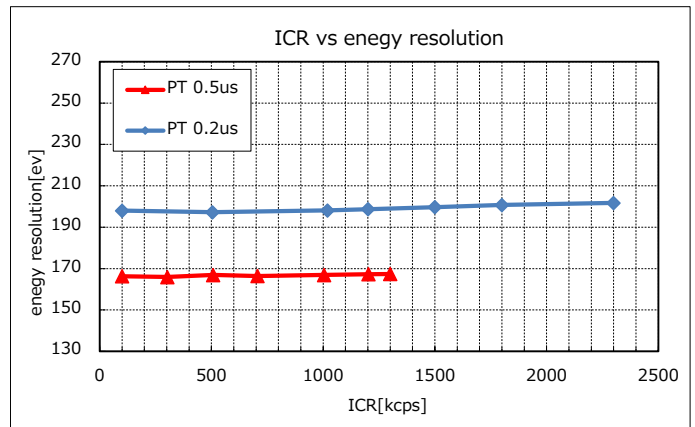


### Hi-count modeの性能

#### 高計数率、出力対応

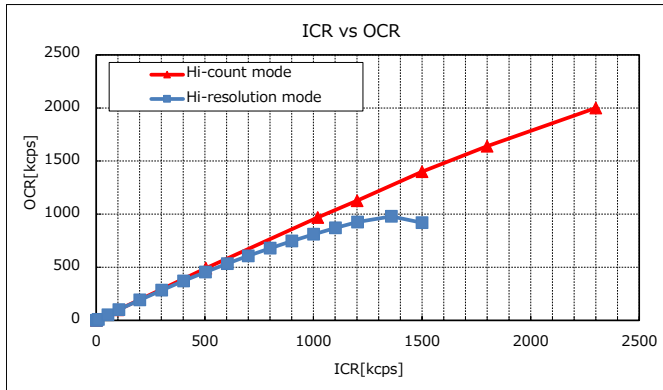


#### 計数に依らない分解能維持性能

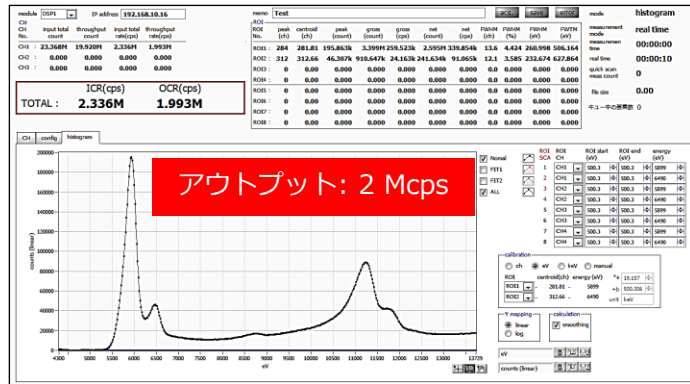


### Hi-count modeと Hi-resolution modeの比較

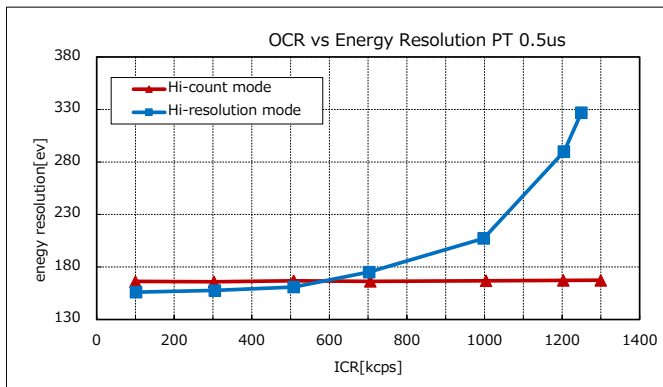
#### 計数率



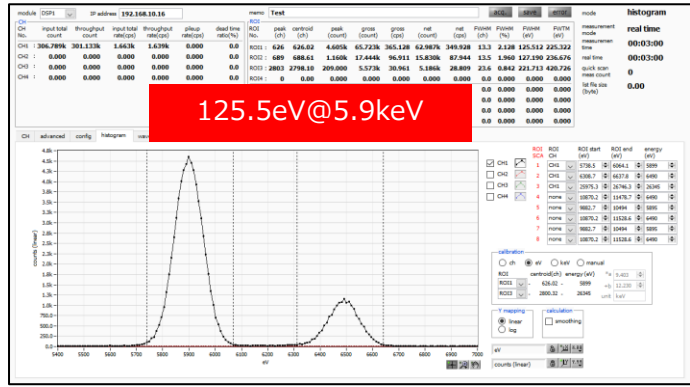
#### Hi-count mode使用 実測定例



#### 分解能



#### Hi-resolution mode使用 実測定例



※写真はイメージです。※記載内容は予告なく変更することがあります。

